

# 「計測分析に関する講演会」 トラブル“ゼロ”をめざして 異物分析の進めかた

## 開催のご案内

共催：あいち産業科学技術総合センター、あいちシンクロトロン光センター

あいち産業科学技術総合センターでは、知の拠点あいちに設置された種々の分析機器を用いた分析や評価を行うことにより、企業の方々の新技術や新製品開発、モノづくりの現場で発生する様々な課題解決の支援をしています。

この度、製品開発現場や製造工程で問題となる様々な“異物”の評価手法について、その基本的な知識を身につけたい方を対象とした講演会を開催します。

当日は、外部講師をお招きし、異物の種類や形状に応じた各種分析法の特長と実際の分析事例をご紹介いただくとともに、センター職員が、異物を調べる際の評価分析の進めかたについて分析事例を交えて紹介します。講演後は、分析や評価に関する個別の技術相談会や、当センターの高度計測分析機器及び隣接するあいちシンクロトロン光センターの見学会を行います。

参加費は無料です。多くの皆様のご参加をお待ちしています。

【日 時】平成 30 年 12 月 6 日(木) 午後 1 時 30 分～午後 5 時 00 分

【場 所】あいち産業科学技術総合センター 1 階 講習会室  
愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 TEL: 0561-76-8315  
東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南」駅 下車すぐ

### 【プログラム】

時間	内容
13:00 ~ 13:30	受付
13:30 ~ 13:40	開会あいさつ
13:40 ~ 14:25	「微小異物も逃がさずキャッチ！ ラマン分光法の基礎からテクニックまでを一挙公開」 日本分光株式会社 光分析ソリューション部 <small>たいら えりか</small> 平 詠里加氏
14:25 ~ 14:35	休憩
14:35 ~ 15:20	「ファクトファインディングを可能とする分析、解析技術の紹介 (何を何でどのようにして視るのか、何を視たいのか知りたいのか)」 JAPAN TESTING LABORATORIES 株式会社 技術部 <small>はやし とみお</small> 林 富美男氏
15:20 ~ 15:30	休憩
15:30 ~ 16:30	「異物分析のススメ (フローチャート、実際の分析例)」 あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部
16:30 ~ 17:00	・見学会 当センター高度計測分析機器、あいちシンクロトロン光センター ・技術相談会 *希望者のみとなります。

■ **申込方法** 下記の申込書にご記入の上、FAX、又は電子メールでお送りください。

■ **申込期限** 平成30年12月4日（火）

■ **参加費** 無料

■ **定員** 100名（申込先着順）

■ **交通のご案内**

- ・ 東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車、北側すぐ
- ・ 猿投グリーンロード八草 IC から西へ約 800 m

■ **申込先及び問合せ先**

あいち産業科学技術総合センター

共同研究支援部 吉田、杉本、中川

〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1

電話：0561-76-8315 FAX：0561-76-8317

電子メール：AIC0000153@chinokyoten.pref.aichi.jp URL：http://www.aichi-inst.jp/



計測分析に関する講演会（12月6日(木)）  
参加申込書

平成30年 月 日

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 吉田、杉本、中川 宛

FAX：0561-76-8317 メール：AIC0000153@chinokyoten.pref.aichi.jp

ふりがな			
企業名			
所在地	〒		
連絡先	TEL	FAX	
	メールアドレス		
	所属部署	氏名	相談・見学会への参加 両方参加も可（ご希望に○をつけて下さい。）
1			相談会参加 見学会参加 不参加
2			相談会参加 見学会参加 不参加
3			相談会参加 見学会参加 不参加
相談内容（相談会参加希望の方はご記入ください）			

※ご記入いただいた個人情報は、セミナー情報の提供等、当センターからの各種連絡のために利用させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

※参加受付証は発行いたしません。直接会場にお越しください。

「センターニュース」のメール配信を希望される方は、チェックしてください。